

晶圓廠 SORTER PM 保養程序

壹、目的

貳、適用時機

參、內容

- 一、機台廠家
- 二、保養程序

肆、生效與修訂



晶圓廠 SORTER PM 保養程序

壹、目的

對晶片傳送進行保養校正以降低刮傷及破片之機率。

貳、適用時機

MPM:30天 ± 14天。

QPM:90天 ± 30天。

參、內容

- 一、機台廠家
 - (1) RECIF Inc. 台灣瑞斯福股份有限公司,型號: SPP150 A54。
 - (2) Nada 那達科技股份有限公司,型號: N2X、N3X、N3X-200F

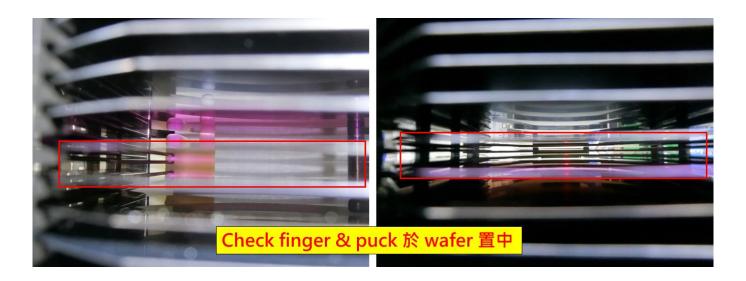


C 3 NO.: G3363-2102 **VERSION:** PAGE:

- 二、保養程序
 - (1) Clean 機台 & 滑軌清理及潤滑
 - (2) 檢查 finger & puck 固定螺絲是否鬆脫

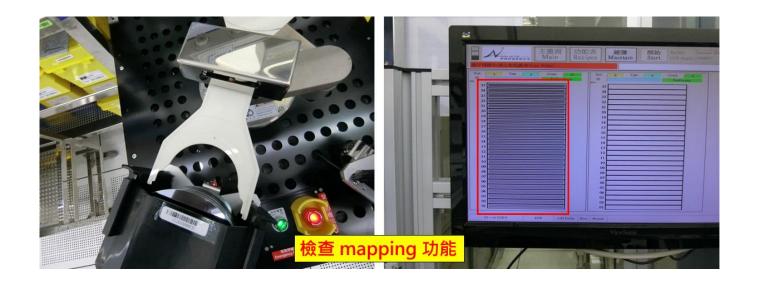


(3) 傳送確認 finger & puck 於兩片 wafer 高低位置置中





(4) 檢查 mapping 功能是否正常,若異常則調整測試至正常



- (5) cycle 1hr 確認 wafer 是否有拖片突出
- (6) 瑞斯福機組確認 finger 及支架水平





5 C NO.: G3363-2102 **VERSION:** PAGE:

(7) 使用 IPA+小白布 clean 靜電消除器之探針



(8) 如遇 QPM 請使用靜電檢測儀器,檢測靜電消除器之功能是否正常, 如異常,請校正靜電消除器 or 更換探針/靜電消除器使其正常。

PS:

靜電消除器除電能力檢測基準:

Decay Time ≤ 5秒 (靜電荷量從1000V降至100V內所需時間) Ion balance 數值於 +-35V 內 (離子平衡後量測之數值)

The above information is the exclusive intellectual property of Nuvoton Electronics and shall not be disclosed, distributed or reproduced without permission from Nuvoton.

表單編號:1110-0001-08-A



6 NO.: G3363-2102 **VERSION:** PAGE: C

(9) 靜電檢測儀器 (型號:基恩斯 SK-H050) 使用說明:

1. 將偵測頭裝上





2. 將偵測頭 connector 與檢測儀器本體連接上





3. 將 connector 護套裝上



4. 按下電源鍵開機





5. 按下 MENU 確認 Mode 為 Charge Plate





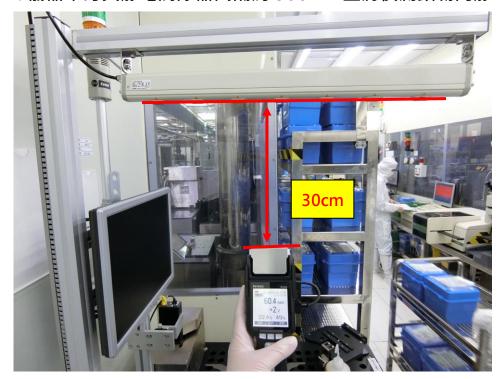
6. 按 BACK 鍵回到 Decay + 頁面







7. 儀器本身與靜電消除器間隔約 30cm, 並將偵測頭朝向靜電消除器



8. 於 Decay + 頁面按下 Start 鍵,偵測頭會 charge 至 +1000V,5秒內 需 decay 至 +100V





9. 按下 ←→ 鍵切換至 Decay - 頁面



10. 於 Decay - 頁面按下 Start 鍵,偵測頭會 charge 至 -1000V,5秒內需 decay 至 -100V





11. 按下 ←→ 鍵切換至 Ion Balance 頁面



12. 於 Ion Balance 頁面按下 Start 鍵,穩定 30秒後 Ion Balance 需在 ±35V內





肆、生效與修訂

本規範之公佈實施及其修訂核准層級皆依會簽/核決/分發依循範例為之。